

Новый метод определения доминирующих дефектов в полупроводниках типа A2B6

Kukk, Peeter-Enn; Aarna, Heiti; Voogne, Maie Второе всесоюзное совещание по химии твердого тела, 11-13 мая 1978 г. Ч. 2
: тезисы докладов 1978 / с. [30-31] https://www.ester.ee/record=b4433699*est